



सत्यमेव जयते

ERTL(N)/FMT/RR/03, Issue No. - 01,11/11/2019



Government of India / भारत सरकार
Ministry of Electronics & Information Technology
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
Standardisation Testing & Quality Certification Directorate
मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय
ELECTRONICS REGIONAL TEST LABORATORY (NORTH)
इलेक्ट्रॉनीकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (उत्तर)



S-Block, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi - 110020

एस-ब्लॉक, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, नई दिल्ली-110020

ULR No.	TC 561822300600041F	
TEST REPORT		PAGE NUMBER.
NUMBER	DATE	01 of 09
ERTL (N) / 2022 / 22KC0151	02 / 12 / 2022	

परीक्षण रिपोर्ट TEST REPORT



Government of India / भारत सरकार
Ministry of Electronics & Information Technology
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
Standardisation Testing & Quality Certification Directorate
मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय
ELECTRONICS REGIONAL TEST LABORATORY (NORTH)
इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (उत्तर)
S-Block, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi - 110020
एस-ब्लॉक, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, नई दिल्ली-110020



TC - 5618

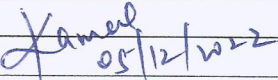
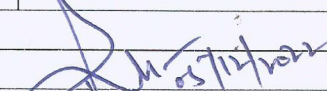
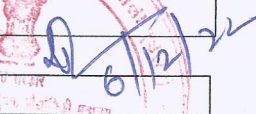
ULR No.	TC 56/8223000 00041 F	
TEST REPORT		PAGE NUMBER
NUMBER	DATE	02 of 03
ERTL (N) / 2022 / 22KC0151	02 / 12 / 2022	

MEMORANDUM / ज्ञापन

1. This Test Report is issued by ELECTRONICS REGIONAL TEST LABORATORY (NORTH) ERTL (N) under STQC Directorate, Ministry of Electronics & Information Technology, Government of India. यह परीक्षण रिपोर्ट मा.प.गु.प्र. निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के तहत, इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (उत्तर) द्वारा जारी की जाती है।
2. This Report is the record of results of testing pertaining to the particular product submitted to the laboratory for testing and do not apply to other products even though declared to be identical. यह रिपोर्ट परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में प्रस्तुत विशेष उत्पाद से संबंधित परीक्षण के परिणामों का रिकॉर्ड है और समतुल्य होने के बावजूद अन्य उत्पादों पर लागू नहीं होती हैं।
3. This Test Report shall not be reproduced, except in full, unless written permission for the publication of an approved abstract has been obtained from the ELECTRONICS REGIONAL TEST LABORATORY (NORTH), New Delhi. यह परीक्षण रिपोर्ट तब तक पुनः प्रस्तुत नहीं की जाएगी : जब तक कि इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (उत्तर) नई दिल्ली से अनुमोदित सामग्री के प्रकाशन के लिए लिखित अनुमति पत्र प्राप्त नहीं किया गया हो।
4. The results reported, in this test report are valid at the time of and under the static condition of measurement. रिपोर्ट में दिये गए परिणाम, इस परीक्षण रिपोर्ट में माप की स्थिर स्थिति के तहत और केवल उस समय के लिए मान्य है।
5. ERTL (N), New Delhi, shall not be liable for any change in the measurement data. इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (उत्तर), नई दिल्ली मापन के आकड़ों में किसी परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।
6. This Test Report is not to be used for any legal purpose and shall not be produced in court of law. यह परीक्षण रिपोर्ट किसी भी कानूनी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए और अदालत में प्रस्तुत नहीं की जाएगी।
7. ERTL (N) provides third party testing and calibration services and does not approve/ certify any product. इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (उत्तर), अन्य पक्ष परीक्षण और अंशांकन सेवाएं प्रदान करता है और किसी भी उत्पाद को अनुमोदित प्रमाणित नहीं करता है।
8. In case of any dispute, the decision of the Director, ERTL (N), New Delhi shall be final and binding. किसी भी विवाद के मामले में, निदेशक, ईआरटीएल (एन), नई दिल्ली का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
9. In general proprietary information submitted by customer, in the Laboratory may not be provided to any third party without the consent of customer, unless until the competent authority is satisfied that the larger public interest warrants the disclosure. ग्राहक द्वारा प्रस्तुत सामान्य स्वामित्व वाली जानकारी को, प्रयोगशाला में ग्राहक की सहमति के बिना किसी भी तीसरे पक्ष को प्रदान नहीं किया जाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि यह प्रकटीकरण बड़े सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक है।
10. To help us improve our services, you are requested to please provide us your feedback/ suggestion, either in the feedback form available in customer services cell along with the report or through email/ fax/ letter. All the information provided by you will be kept confidential. हमारी सेवाओं को बेहतर बनाने में हमारी सहायता करें, आपसे अनुरोध है कि कृपया अपनी प्रतिक्रिया सुझाव हमें प्रदान करें / या तो ग्राहक सेवा सेल में उपलब्ध फीडबैक फॉर्म को रिपोर्ट के साथ या ईमेल/ फैक्स/ पत्र के माध्यम से भेजें आपके द्वारा दी गई सूचना को गोपनीय रखा जाएगा।

	Government of India / भारत सरकार Ministry of Electronics & Information Technology इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय Standardisation Testing & Quality Certification Directorate मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय ELECTRONICS REGIONAL TEST LABORATORY (NORTH) इलेक्ट्रॉनीकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (उत्तर) S-Block, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 एस-ब्लॉक, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110020	 TC-5618
ULR No.	TC561822300000041F	
TEST REPORT	PAGE NUMBER	
NUMBER	DATE	3 of 9
ERTL(N)/2022/22KC0151	02/12/2022	

1. Service Request Form	Number	22T0102
	Date	17/11/2022
2. Customer	Name	M/s. ASES SECURITY PVT. LTD.
	Address	301, Aggarwal Tower LSC-II, Main Road Mandawali, Patparganj, Delhi-110092
3. Manufacturer (As declared by customer)	Name	M/s. ASES SECURITY PVT. LTD.
	Address	A2/69, Site IV, Industrial Area, Sahibabad (Ghaziabad)
4. Description of Item	Discipline	Electronics
	Product group	Electronic Components & Equipment Sub Assemblies.
	Product Nomenclature	10 LOOP ANALOGUE ADDRESSABLE FIRE
	Make /Trade Mark	ASES
	Model No./Type No.	AS-801-FAP
	Number of sample/	01/
	Serial No.	220001006
	Year of Manufacture	2022
	Condition	Good
	Date of receipt of Item/Commencement	18/11/2022
5. Name & address where testing carried out (In-house/Subcontracting/Single window service/On-site/Using Customer Facilities)	ELECTRONICS REGIONAL TEST LABORATORY (NORTH) Okhla Industrial Area Phase-II, New Delhi-110020	
6. Applicable standard/ specification	IS:2189:1999 (Cl.-7.1 / Annexure-B: B-2.2, 2.3.1)	
7. Test Method/ Operating Procedure	IS:2189:1999 (Cl.-7.1 / Annexure-B: B-2.2, 2.3.1)	
8. Environmental Conditions	Temperature	25±2°C
	Relative Humidity	45-75%
9. No. of Annexure (If any)	Nil	

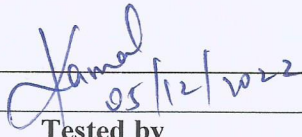
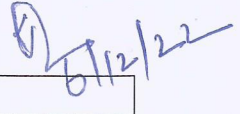
 Tested by	 Approved by	 Issued by
Kamal Saraswat SO-SB	Sulekh Chand Scientist 'F'	Sunita Binji Scientist 'D'

	Government of India / भारतसरकार Ministry of Electronics & Information Technology इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय Standardisation Testing & Quality Certification Directorate मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय ELECTRONICS REGIONAL TEST LABORATORY (NORTH) इलेक्ट्रॉनीकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (उत्तर) S-Block, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 एस-ब्लॉक, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110020	 TC-5618
ULR No.	TC561822300000041F	
TEST REPORT		PAGE NUMBER
NUMBER	DATE	4 of 9
ERTL(N)/2022/22KC0151	02/12/2022	

10. Details of Test Equipments used:

Sl. No.	Nomenclature	Make	Model/ Type No.	Calibration Valid up to
1.	Climatic Test Chamber	CME	PAC-1000-A-3K	24/02/2023
2.	Digital Multimeter	Rishabh	RISH Multi 18S-ir	28/03/2023

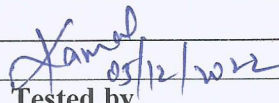
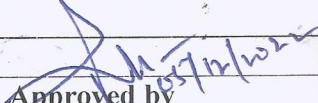
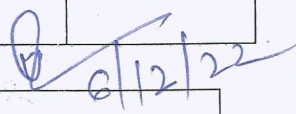
Note :- The equipments were within valid calibration at the time of testing was performed.

 Tested by Kamal Saraswat SO-SB	 Approved by Sulekh Chand Scientist 'F'	 Issued by Sunita Binji Scientist 'D'
--	---	--

	Government of India / भारत सरकार Ministry of Electronics & Information Technology इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय Standardisation Testing & Quality Certification Directorate मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय ELECTRONICS REGIONAL TEST LABORATORY (NORTH) इलेक्ट्रॉनी की क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (उत्तर) S-Block, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 एस-ब्लॉक, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110020		 TC-5618
	ULR No. TC561822300000041F		
TEST REPORT		PAGE NUMBER	
NUMBER	DATE		
ERTL(N)/2022/22KC0151	02/12/2022	5 of 9	

11. Test Results:

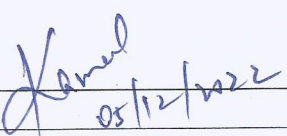
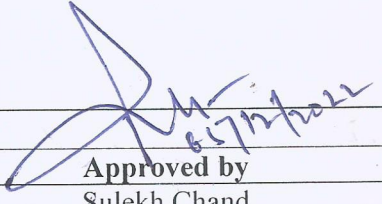
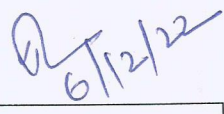
Sl. No.	Clause No.	Parameter & Test conditions	Test Requirements	Measured Values/ Observations	Uncertainty (±%)	Remarks
1.	7.1, Annex.-B, B-2.2	Pre Functional Test At reference voltage: 230V DUT under normal operating condition	The test consist of the following operation in sequence: a) Operate momentarily a trigger device (automatic detector /mcp) from any zone to ensure correct functioning. b) Operate alarm silencing switch to ensure correct functioning. c) Operate another trigger device (detector /mcp) from another zone to ensure correct functioning of C&I equipment and sector /zonal panel, in case of big /sectorred equipment. d) Operate reset control to ensure correct functioning. e) Check the audible and visible warnings given on disconnection of normal (mains) power. f) Restore the equipment to quiescent condition.	In-compliance	Not Applicable	Satisfactory

 Tested by Kamal Saraswat SO-SB	 Approved by Sulekh Chand Scientist 'F'	 Issued by Sunita Binji Scientist 'D'
--	---	--

	Government of India / भारत सरकार Ministry of Electronics & Information Technology इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय Standardisation Testing & Quality Certification Directorate मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय ELECTRONICS REGIONAL TEST LABORATORY (NORTH) इलेक्ट्रॉनीकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (उत्तर) S-Block, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 एस-ब्लॉक, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110020	 TC-5618
ULR No.	TC561822300000041F	
TEST REPORT	PAGE NUMBER	
NUMBER	DATE	6 of 9
ERTL(N)/2022/22KC0151	02/12/2022	

11. Test Results:

Sl. No.	Clause No.	Parameter & Test conditions	Test Requirements	Measured Values/ Observations	Uncertainty (±%)	Remarks
2.	7.1, Annex-B, B-2.3.1	Dry Heat Test (at 45 deg. C for 16 Hrs.) DUT in OFF condition	Conditioning	Conditioned	Not Applicable	Not Applicable
2.1	---	Visual Examination	Shall show no damage.	In-compliance	Not Applicable	Satisfactory

 Tested by Kamal Saraswat SO-SB	 Approved by Sulekh Chand Scientist 'F'	 Issued by Sunita Binji Scientist 'D'
---	--	---

	Government of India / भारत सरकार Ministry of Electronics & Information Technology इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय Standardisation Testing & Quality Certification Directorate मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय ELECTRONICS REGIONAL TEST LABORATORY (NORTH) इलेक्ट्रॉनीकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (उत्तर) S-Block, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 एस-ब्लॉक, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110020	 TC-5618
ULR No.	TC561822300000041F	
TEST REPORT		PAGE NUMBER
NUMBER	DATE	7 of 9
ERTL(N)/2022/22KC0151	02/12/2022	

11. Test Results:

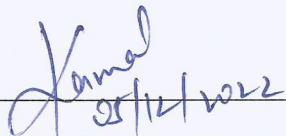
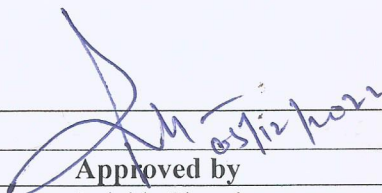
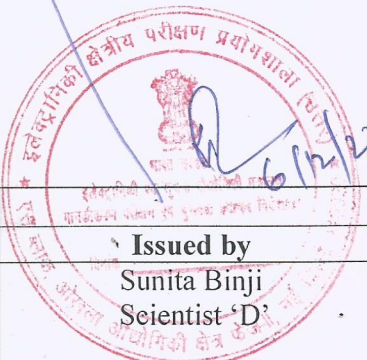
Sl. No.	Clause No.	Parameter & Test conditions	Test Requirements	Measured Values/ Observations	Uncertainty (±%)	Remarks
3.	7.1, Annex. -B, B-2.2	Post Functional Test At reference voltage: 230V DUT under normal operating condition	The test consist of the following operation in sequence: a) Operate momentarily a trigger device (automatic detector /mcp) from any zone to ensure correct functioning. b) Operate alarm silencing switch to ensure correct functioning. c) Operate another trigger device (detector /mcp) from another zone to ensure correct functioning of C&I equipment and sector /zonal panel, in case of big /sectorred equipment. d) Operate reset control to ensure correct functioning. e) Check the audible and visible warnings given on disconnection of normal (mains) power. f) Restore the equipment to quiescent condition.	In-compliance	Not Applicable	Satisfactory

Tested by	Approved by	Issued by
Kamal Saraswat SO-SB	Sulekh Chand Scientist 'F'	Sunita Binji Scientist 'D'

	Government of India / भारत सरकार Ministry of Electronics & Information Technology इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय Standardisation Testing & Quality Certification Directorate मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय ELECTRONICS REGIONAL TEST LABORATORY (NORTH) इलेक्ट्रॉनीकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (उत्तर) S-Block, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 एस-ब्लॉक, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110020	 TC-5618
ULR No.	TC561822300000041F	
TEST REPORT	PAGE NUMBER	
NUMBER	DATE	8 of 9
ERTL(N)/2022/22KC0151	02/12/2022	

12. Remarks:

a)	This Test Report pertains to parameter(s) mentioned in the test results column at Sl. No.11.
b)	Device Under Testing (DUT) meets the requirements of the applicable specification i.e. IS:2189/1999 (Cl.-7.1, Annexure-B: B-2.2 & B-2.3.1.) .
c)	Compliance / Non Compliance reported against parameters is based on decision rule agreed by the customer.
d)	The parameters were tested on randomly selected any one loop (zone) of the DUT.
e)	DUT is tested along with following mentioned Accessories i.e Smoke Detector(Model No: AS-801-SD), Heat Detector(Model No: AS-801-HD), Multi Detector(Model No: AS-801-PTD), MCP(Model No: AS-801-MCB), Hooter with Flasher(Model No: H-ABS-V), Monitor Module(Model No: AS-801-MM) and Control Module(Model No: AS-801-CM)

		
Tested by	Approved by	Issued by
Kamal Saraswat SO-SB	Sulekh Chand Scientist 'F'	Sunita Binji Scientist 'D'

 Government of India / भारत सरकार Ministry of Electronics & Information Technology इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय Standardisation Testing & Quality Certification Directorate मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय ELECTRONICS REGIONAL TEST LABORATORY (NORTH) इलेक्ट्रॉनीकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (उत्तर) S-Block, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi - 110020 एस-ब्लॉक, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, नई दिल्ली-110020  TC - 5618		
ULR No.	TC 5618 223000 00041F	
TEST REPORT		PAGE NUMBER
NUMBER	DATE	09 of 09
ERTL (N) / 2022/ 22KC0151	02.12.2022	

ERTL(N) ACCREDITATIONS / RECOGNITIONS

ईआरटीएल (एन) मान्यताएं

- ★ Accredited under National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) for Calibration and Testing as per scope.
परीक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड और अंशांकन के लिए परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं (NABL) के तहत मान्यता प्राप्त है।
- ★ Recognition by BIS for safety testing under Compulsory Registration Scheme (CRS) of MeitY.
MeitY की अनिवार्य पंजीकरण योजना (CRS) के तहत सुरक्षा परीक्षण के लिए BIS द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- ★ Recognition by BIS for testing of Electrical and Electronics products.
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के परीक्षण के लिए बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- ★ Approved by STQC Directorate under Safety Certification Scheme (S-Mark) Scheme.
सुरक्षा प्रमाणन योजना (एस-मार्क) योजना के तहत मा.प.गु.प्र. निदेशालय द्वारा अनुमोदित।
- ★ Recognized by TEC, Department of Telecom under Mandatory Testing and Certification Telecom Equipment (MTCTE) Scheme.
अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन दूरसंचार उपकरण (MTCTE) योजना के तहत दूरसंचार विभाग, वीईसी द्वारा मान्यता प्राप्त।